3D05

赤外・可視和周波発生顕微鏡による有機電界効果トランジスタ電極界面におけるキャ リアー空間分布測定

(京大院理1,分子研2) 〇立岡正明1,中井郁代1,上田正2,渡邊一也1,松本吉泰1,2

[序]

近年、有機物質を用いた電子デバイスの開発が盛んに行われており、実用化に向け て研究が進められている。有機電界効果トランジスタ(OFET)もその一つである。

OFETではゲート電圧V_Gを印加することでcarrierが生成され、有機薄膜層と絶縁体 薄膜層の界面に分布することが知られているが、どのような空間分布をとるのかは理 解されていない。我々は振動分光を用いてcarrierの空間分布マッピングを行うことを 目指して赤外・可視和周波発生(SFG)振動分光法と顕微鏡を組み合わせたシステム を構築した。今回ペンタセンを用いたOFETにこれを適用し、SFG顕微鏡画像測定を 試みた。

[実験]

試料はSiウェハー上にSiO₂薄膜(膜厚 150nm)を生成し、その上に金電極(幅 5μm) を蒸着した後にペンタセン層(膜厚 50nm)を蒸着し作成した。デバイス構造はbottom - contact型である。

測定は既報のSFG顕微鏡を用いた¹⁾。光源にはピコ秒Ti:sapphire再生増幅器を用い、出力(800nm,~2ps)の一部を'可視光'とし、残りの出力を用いてOPG/OPA システムをポンプしその出力のDFGにより赤外光(2650cm⁻¹~3200cm⁻¹)を得た。これ らの光を試料に照射し、発生したSFG信号像を回折格子に投影し、対物レンズで拡大 してCCDカメラで検出した。図1に試料断面図と光学配置模式図を示す。ここで、ゲ ート電圧Vgとは、図中に示すソース電極に対するゲート電極の電位を指す。



図1 試料断面図及び光学配置模式図

[結果と考察]

 $V_G = 0V$ で観測したSFG顕微鏡像を図2に 示す。入射光強度の空間分布による規格化は 行っていない。2本の金電極部分と電極間領 域でSFG信号が顕著に観測されている。ペン タセンを蒸着していない試料でも測定を行っ たが、SFG信号が観測されたのは金電極部分 からのみであった。従って、電極間領域で観 測されたSFG信号はペンタセンに由来するも のであると考えられる。また、 $V_G = 0V$ で赤外 光を掃引し(2650cm⁻¹~3200cm⁻¹)、振動スペク トルの測定を試みたが、ペンタセンに帰





属される明確な振動構造は確認されなかった。従って電極間領域で観測された SFG 信号は振動非共鳴項に由来する信号が支配的であると考えられる。

図2の顕微鏡像を横軸方向に積分した強度プロットを図3に示す。 $V_G \neq 0V$ でも 同様の測定を行い、その結果も示した。 V_G を印加することで電極間領域のSFG信号 強度が著しく増加していることがわかる。

図3中の矢印で示された電極間領域を積分し、その積分値 I_{SFG} の平方根を V_G に対してプロットした結果を図4に示す。(I_{SFG})^{1/2} と V_G の間に比例関係が認められる。

 V_{G} 印加によるSFG信号強度増強機構として 1) V_{G} 印加により界面に生成した carrierによる $\chi^{(2)}$ の増大、2) V_{G} 印加によって発生した局所的な電場による $\chi^{(3)}$ 過程、が 考えられる。

SFG信号強度増強のV_G依存性は試料によって測定結果のばらつきが大きく、低い |V_G|で増強が飽和する試料や増強を示さない試料も存在した。増強を示さない試料 ではトランジスタ特性も示さなかったことが確認され、今回観測されたSFG信号強度 増強とトランジスタ特性には密接な関係があるものと考えられる。



[謝辞] 試料を作成し、ご提供下さったソニー株式会社 鵜川彰人氏に感謝致します。 1) 中井ら、 日本化学会第 87 回春季年会 3 G1 - 29 (2007).